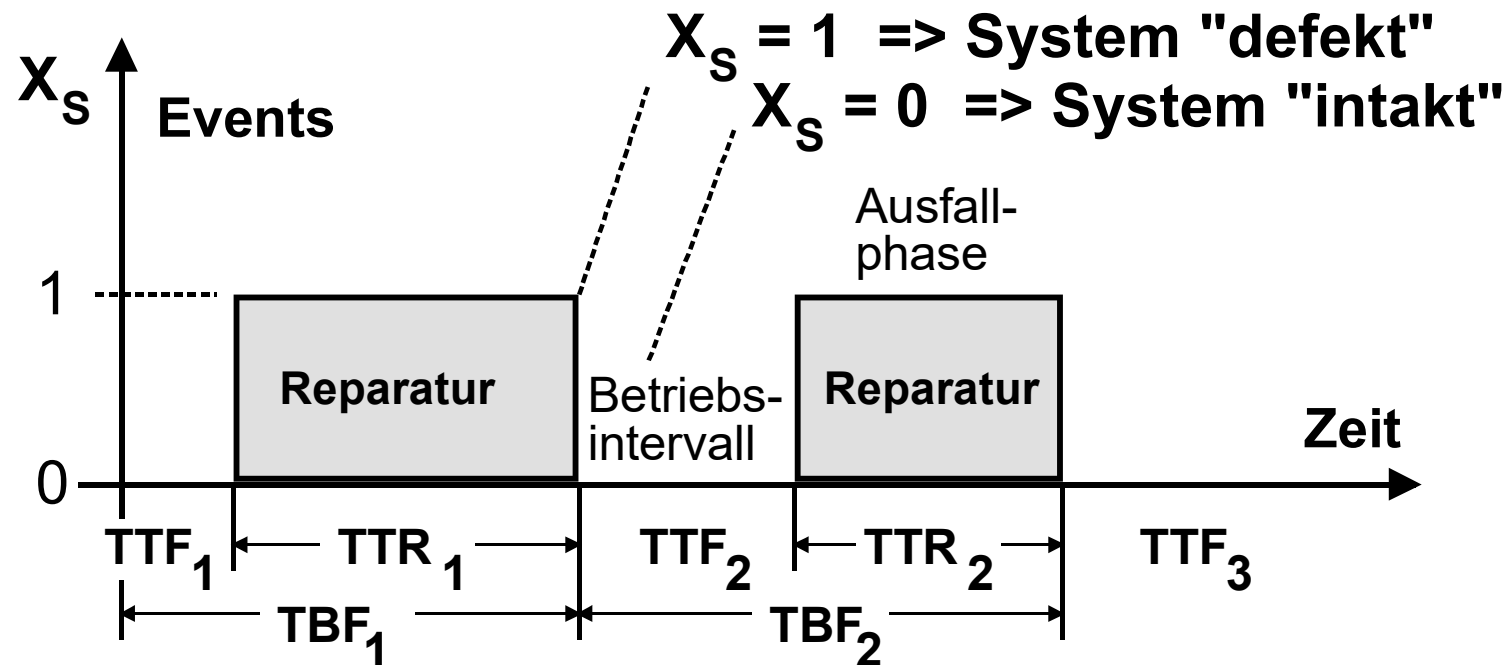


3. Graphische Hilfsmittel und systemtheoretische Grundlagen

- 3.1 Indikatorvariable und Redundanzstruktur-Funktion
- 3.2 Zeit- und Balkendiagramme
- 3.3 Zuverlässigkeits-Blockschaltbilder und Fehlerbäume
- 3.4 Zustandsdiagramme und Petrinetze
- 3.5 Systemtheoretische Grundlagen

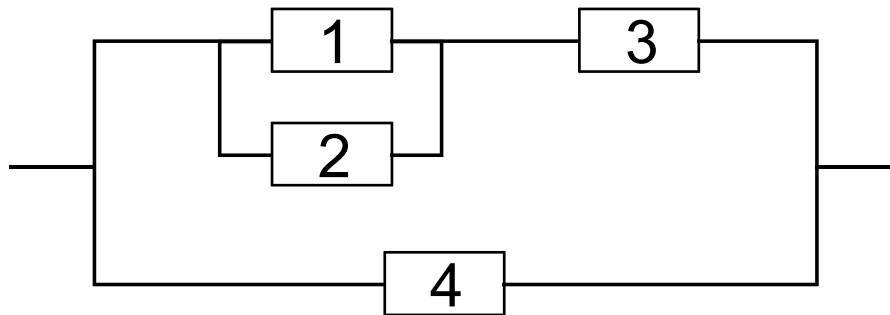


TTF = Time To Failure **TTR** = Time To Repair

TBF = Time Between Failure

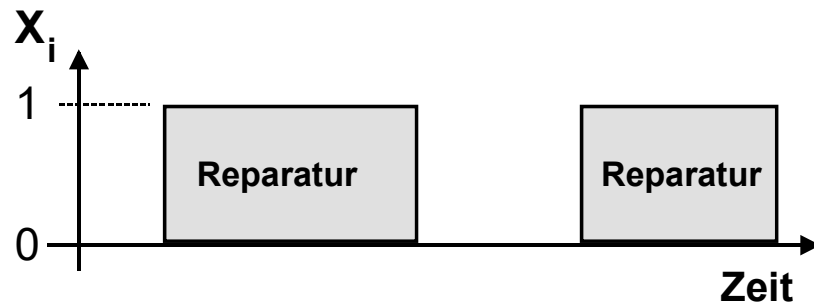
Abschnitt 3.1

Redundanzstruktur-Funktion



Indikatorvariable (der Komponente):

$$X_i(t) = \begin{cases} 1 & \Rightarrow \text{Komponente } K_i \text{ defekt} \\ 0 & \Rightarrow \text{Komponente } K_i \text{ intakt} \end{cases}$$



- System **S** besteht aus den Einzelkomponenten **K₁**, **K₂**, **K₃** und **K₄**
- Darstellung des Systemzustandes **S** durch den Zustand der Komponenten

Redundanzstruktur-Funktion:

$$X_S(t) = \begin{cases} 1 & \Rightarrow \text{für alle } X_i, \text{ für die } S \text{ in } t \text{ defekt} \\ 0 & \Rightarrow \text{für alle } X_i, \text{ für die } S \text{ in } t \text{ intakt} \end{cases}$$

Un- bzw. Verfügbarkeit (der Komponente) im Zeitpunkt t_0 :

$$U_i = P\{X_i(t_0) = 1\} \quad V_i = P\{X_i(t_0) = 0\}$$

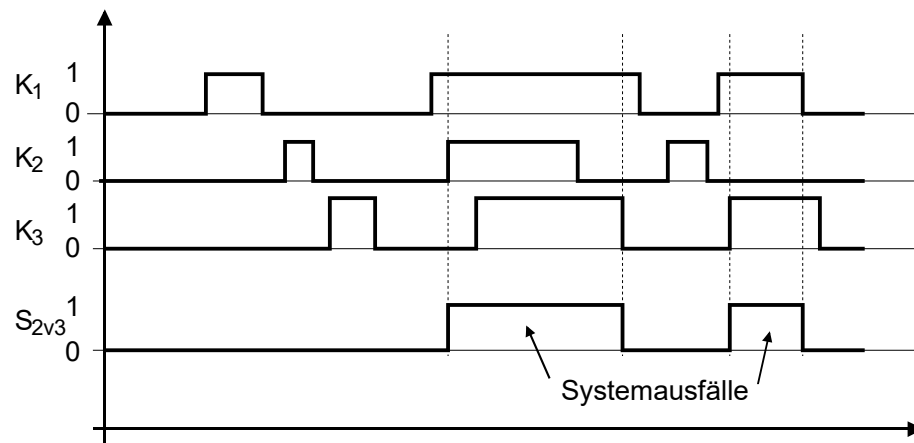
Verfügbarkeit (des System S):

$$V_S = P\{X_S(t_0) = 0\} = f(V_1, V_2, V_3, V_4)$$

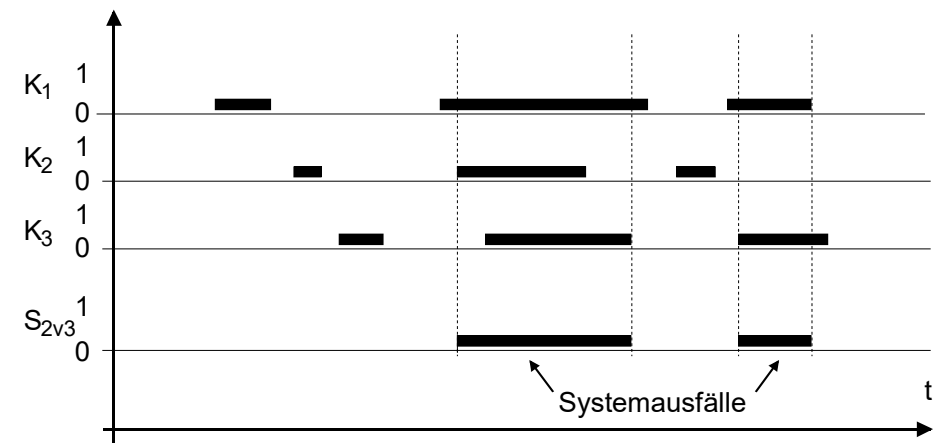
Abschnitt 3.2

Zeit- und Balkendiagramm

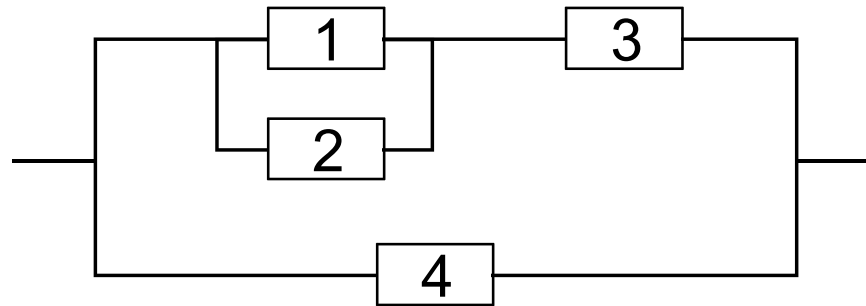
Zeitdiagramm



Balkendiagramm



2v3-System: Zwei von insgesamt drei Komponenten müssen intakt sein, damit das System funktioniert (ansonsten Systemausfall)



System S intakt, wenn es wenigstens einen Pfad (Kantenzug) mit ausschließlich intakten Komponenten gibt.

- System **S** als Gerichteter Graph
- Komponenten **K_i** als Rechtecke mit Nummern oder Namen
- zeigt die Redundanzstruktur des Systems an
- funktionsorientiertes Modell

Ergebnis:

$$V_S = (V_1 + V_2 - V_1 \cdot V_2) \cdot V_3 \cdot (1 - V_4) + V_4$$

Abschnitt 3.3

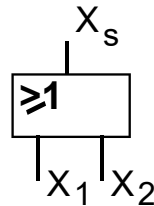
Zuverlässigkeits-Blockschaltbild

Serienschaltung:



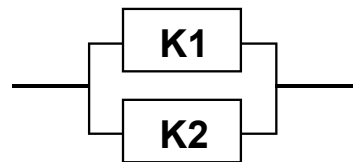
X_1	X_2	X_s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(ODER-Verknüpfung)



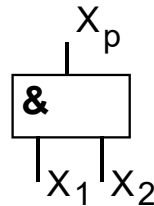
$$V_s = V_1 \cdot V_2$$

Parallelschaltung:



X_1	X_2	X_p
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

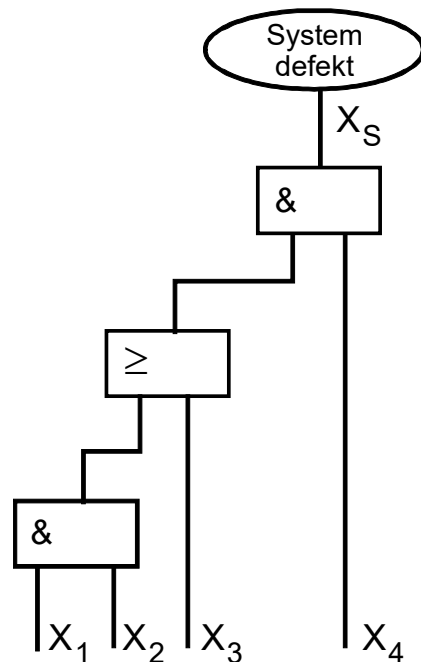
(UND-Verknüpfung)



$$V_p = V_1 + V_2 - V_1 \cdot V_2$$

$$U_p = U_1 \cdot U_2 \rightarrow 1 - V_p = (1 - V_1) \cdot (1 - V_2)$$



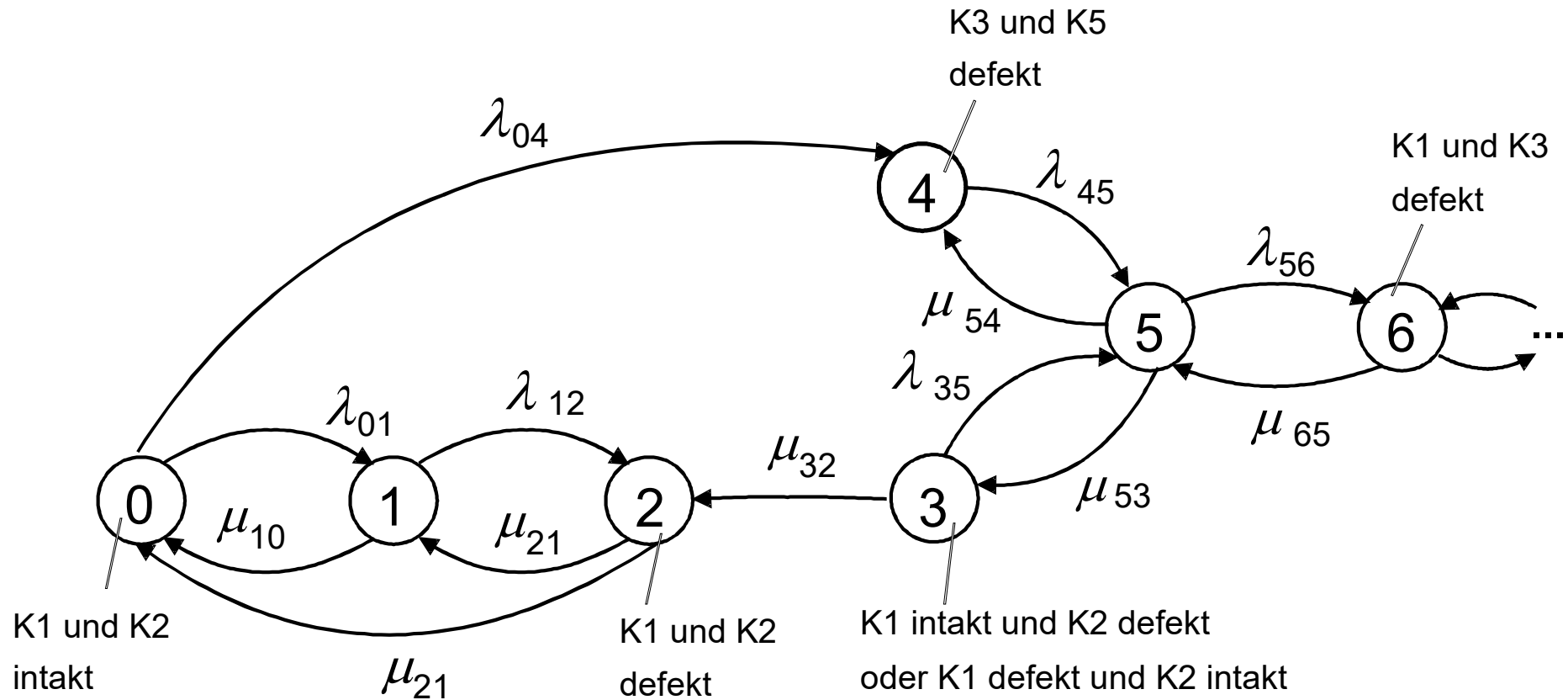


- Baumähnliche graphische Darstellung Boolescher Funktionen
- Komponentenausfälle als Blätter des Baumes
- zeigt die Redundanzstruktur des Systems an
- fehlerorientiertes Modell

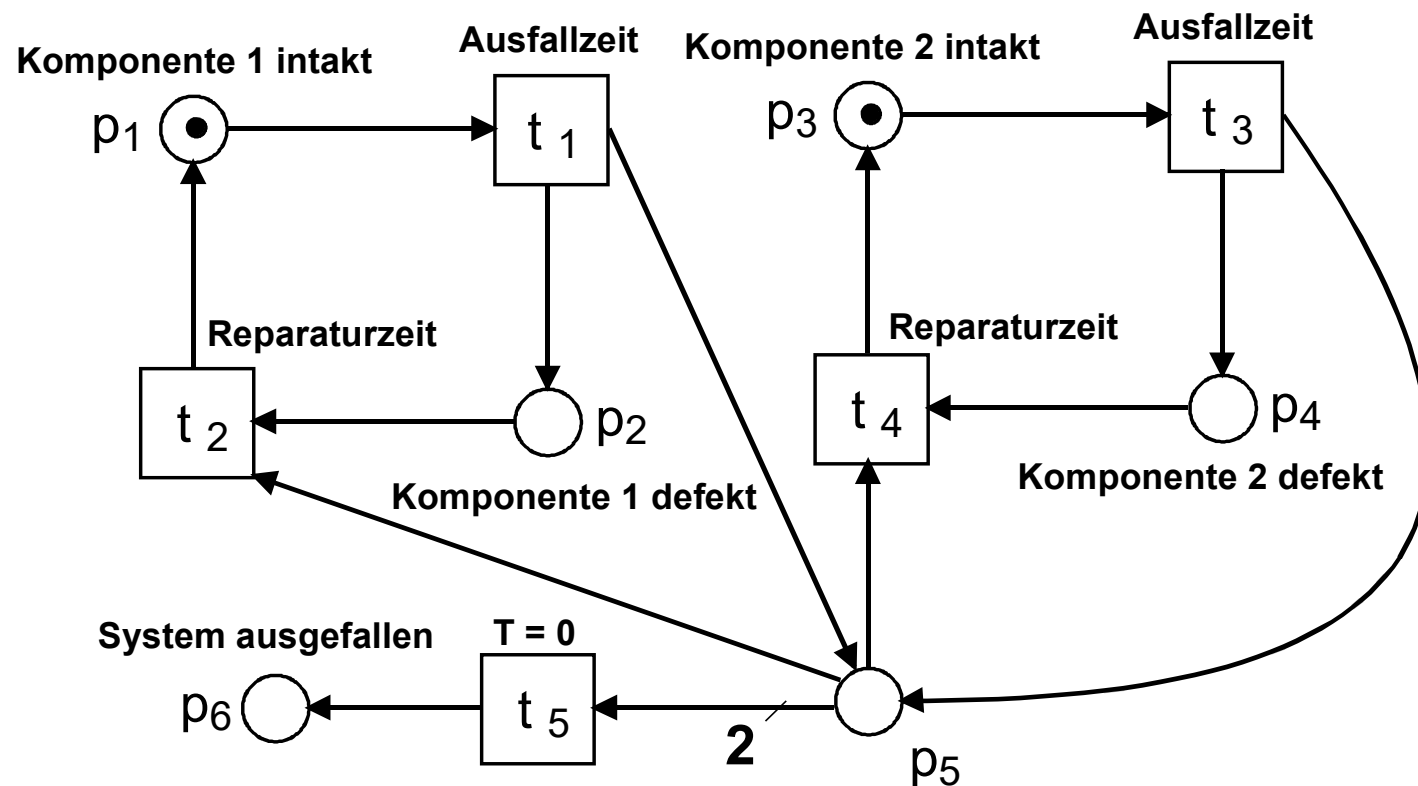
System S defekt, wenn die Wurzel des Baumes ein **aktives** Signal zeigt

Ergebnis (Mathematische Behandlung siehe Absch. 3.5, S. 34 ff.):

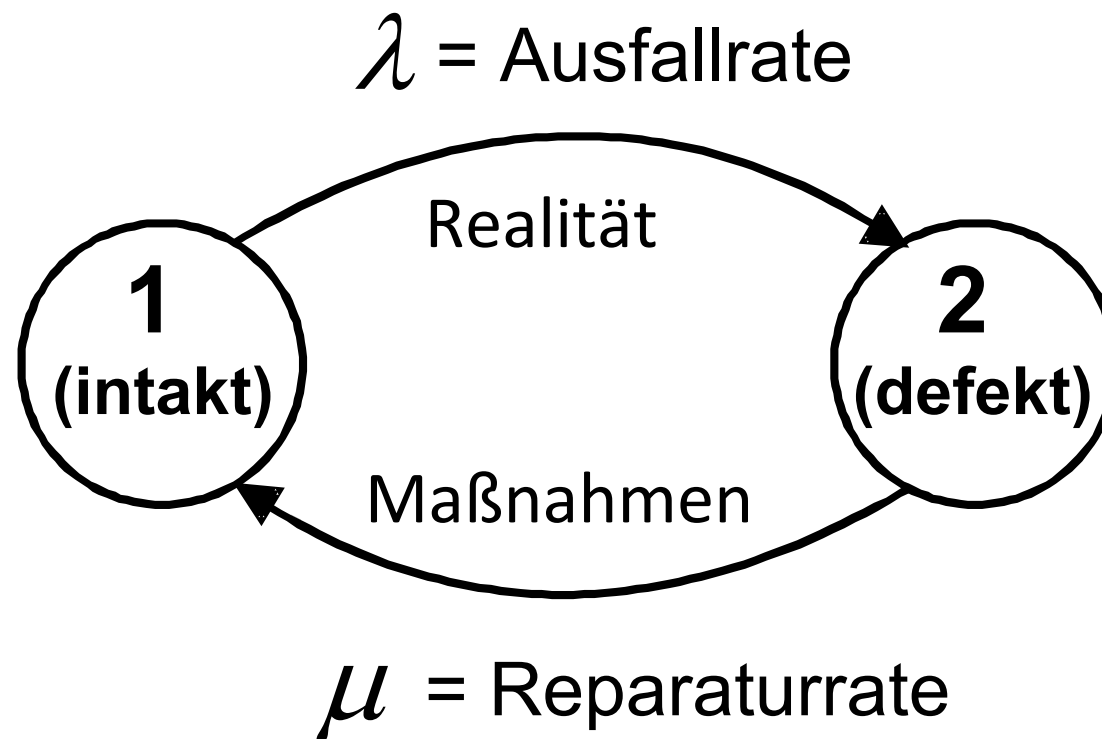
$$X_S = ((X_1 \wedge X_2) \vee X_3) \wedge X_4$$



Petrinetze:



Modellbildung für ein **reparierbares** System:



Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -\lambda \cdot P_1(t) + \mu \cdot P_2(t)$$

Normierungsbedingung:

$$P_1(t) + P_2(t) = 1$$

Verfügbarkeit:

$$V_S = \lim_{t \rightarrow \infty} P_1(t)$$

Kenngrößen aus wahrscheinlichkeitstechnischer Sicht:

- **Zuverlässigkeit (Reliability):**

Beschaffenheit einer Funktionseinheit bzgl. ihrer Fähigkeit, während oder nach vorgegebenen Zeitspannen bei festgelegten Betriebsbedingungen die Zuverlässigkeitsanforderungen zu erfüllen (DIN 40 041, DIN 55 350).

- **Verfügbarkeit (Availability):**

Wahrscheinlichkeit, ein System zu einem vorgegebenen Zeitpunkt t in einem **funktionsfähigen** Zustand anzutreffen (DIN 40 042, ISO/IEC 2382, 7498, 9126 und 2003).

Weitere Kenngrößen:

- **Unverfügbarkeit (Unavailability):**

... U ist das **1er-Komplement** der Verfügbarkeit V , d. h.:

$$U := 1 - V$$

- **Lebensdauer (Life Time):**

... für die einzelne **nicht instandsetzbare** Betrachtungseinheit die beobachtete **Zeitspanne L** vom Beanspruchungsbeginn t_0 bis zum Ausfallzeitpunkt t_F :

$$L := t_F - t_0$$

Weitere Kenngrößen:

- **Downtime DT in [min/yr]:**

... die **Zeitdauer**, für die die Dienste bzw. die Funktionalität eines Systems in einen bestimmten Zeitraum (meistens **bezogen auf ein Jahr**) nicht verfügbar sind. Typisch ist der Durchschnittswert über eine große Zahl von Benutzern.

$$DT = U * 525.600 \text{ [min/yr]}$$

wobei

U = Unavailability

525.600 = $365 * 24 * 60$ (1 Jahr entspricht **525.600** Minuten)

Erwartungs- bzw. Durchschnittswerte:

$MTTF = \text{avg } \langle TTF_i \rangle$ Mean Time To Failure
(mittlere ausfallfreie Zeitspanne)

$MTTR = \text{avg } \langle TTR_i \rangle$ Mean Time To Repair
(mittlere Ausfalldauer)

$MTBF = \text{avg } \langle TBF_i \rangle$ Mean Time Between Failure
(mittlere Zeitdauer zwischen Ausfällen)

Bei uns gilt stets:

$$\mathbf{MTBF = MTTF + MTTR}$$

Ausfall- und Reparaturrate:

Ausfallrate λ : $\lambda = 1 / \text{MTTF}$

Reparaturrate μ : $\mu = 1 / \text{MTTR}$

Mittlere Fehlerhäufigkeit ν : $\nu = 1 / \text{MTBF}$
(bzw. durchschnittliche Fehlerrate AFR)

Demnach gilt der Zusammenhang:

$$\nu = \lambda * \mu / (\lambda + \mu)$$

Kenngrößen eines **reparierbaren** Systems:

- Mit Hilfe von MTTF und MTBF lassen sich die **Verfügbarkeit V**, die **Unverfügbarkeit U** und die **durchschnittliche Fehler-rate AFR** experimentell aus dem Systemverhalten ermitteln.
- Umgekehrt beschreiben **V**, **U** und **AFR** das Systemverhalten eines **reparierbaren** Systems dann, wenn sich **Betriebsintervalle** (*System = intakt*) und **Ausfallphasen** (*System = defekt*) abwechseln.
- Im **stationären Fall** gilt:

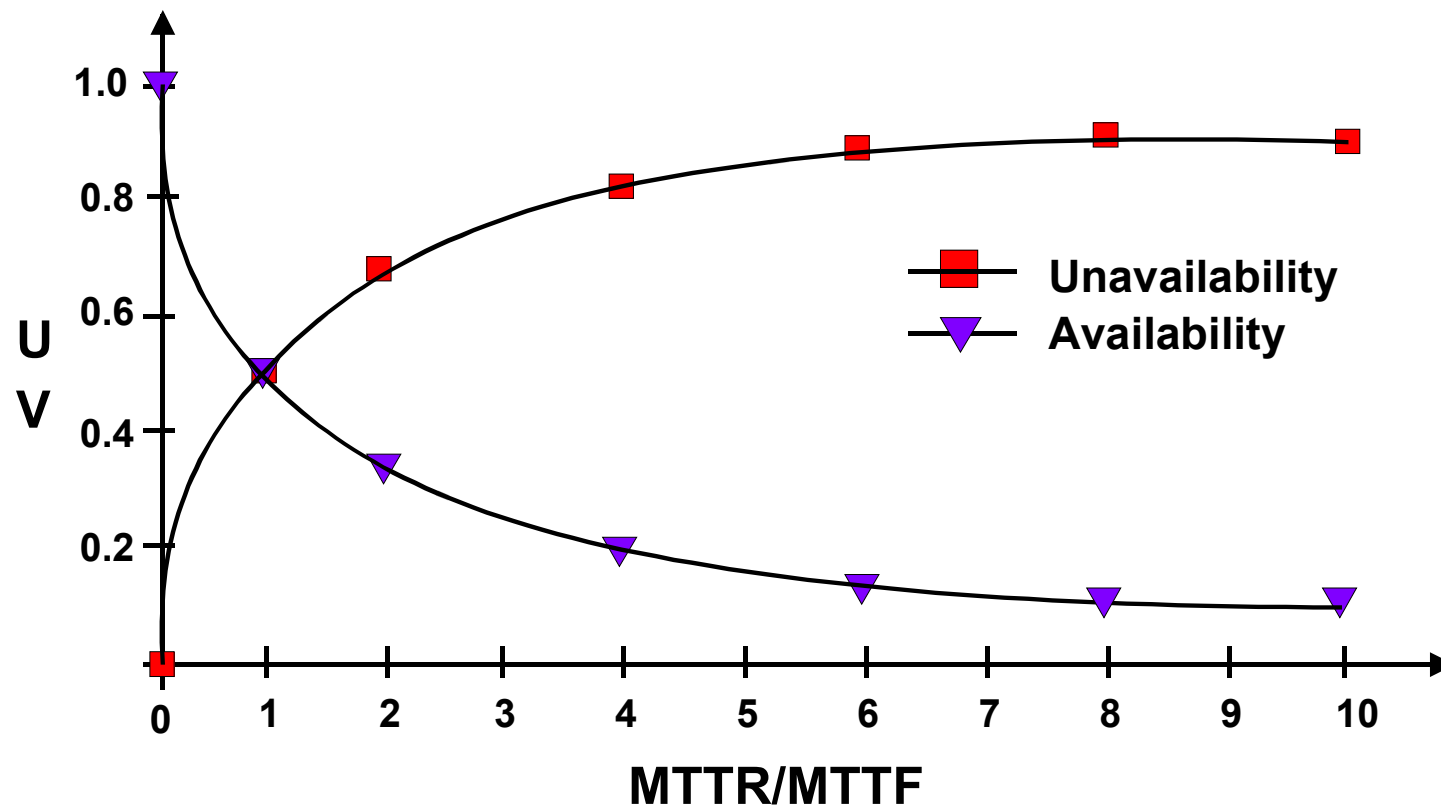
Kenngrößen eines **reparierbaren Systems**:

$$V = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} = 1 - U$$

$$U = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{MTTR}{MTTF + MTTR} = 1 - V$$

$$AFR = \nu = \frac{1}{MTBF} = \frac{\lambda \cdot \mu}{\lambda + \mu}$$

V und U als Funktion von MTTR/MTTF:



Rechenbeispiel:

Verfügbarkeit	Unverfügbarkeit	Downtime
99.99 %	0.01 %	53 min/yr
99.98 %	0.02 %	106 min/yr
99.95 %	0.05 %	265 min/yr
99.90 %	0.10 %	530 min/yr

Kenngrößen eines **nicht-reparierbaren** Systems:

... diese drücken das Systemverhalten bei **ununterbrochenem Betrieb** **ohne** zwischengeschobenen Reparaturphasen aus.

- Lebensdauer (Life Time) $\rightarrow L$
- Mittlere Lebensdauer (Mean Life Time) $\rightarrow T_M := \langle L \rangle = \text{MTTF}$
- Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability Of Failure) $\rightarrow F(t)$
- Überlebenswahrscheinlichkeit $\rightarrow R(t) = 1 - F(t)$
- Ausfallrate oder Ausfallhäufigkeitsdichte $\rightarrow A(t)$

Mittlere Lebensdauer T_M :

$$T_M = E(L) = \langle L \rangle := \int_0^{+\infty} t \cdot f_L(t) dt = \int_0^{+\infty} R(t) dt$$

wobei

L = Lebensdauer ($L \geq 0$)

$E(L)$ = Erwartungswert der Lebensdauer

f_L = Dichtefunktion der Lebensdauer

$R(t)$ = Überlebenswahrscheinlichkeit

Ausfallwahrscheinlichkeit:

Wahrscheinlichkeit einer Betrachtungseinheit des Anfangbestandes (die zum Zeitpunkt $t = 0$ intakt ist) bis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt t auszufallen $\rightarrow F(t)$

\Rightarrow entspricht der **Verteilungsfunktion der Lebensdauer !**
d. h.

$$F(t) = F_L(t)$$

Ausfallwahrscheinlichkeit:

$$F(t) = P(L \leq t) := F_L(t) := \int_0^t f_L(\tau) d\tau$$

wobei

L = Lebensdauer

P = Wahrscheinlichkeit

f_L = Dichtefunktion der Lebensdauer

F_L = Verteilungsfunktion der Lebensdauer

F = Ausfallwahrscheinlichkeit

Überlebenswahrscheinlichkeit:

Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist das Komplement der Ausfallwahrscheinlichkeit zu 1 $\rightarrow \mathbf{R(t)}$

d. h.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Überleben-} \\ \text{wahrschein-} \\ \text{lichkeit} \end{array} \right\} = 1 - \left\{ \begin{array}{l} \text{Ausfall-} \\ \text{wahrschein-} \\ \text{lichkeit} \end{array} \right.$$

bzw.

$$\mathbf{R(t) = 1 - F(t)}$$

Ausfallrate $A(t)$:

Die Ausfallrate ist ein Maß für die temporäre Ausfallhäufigkeit und damit für die Ausfallhäufigkeitsdichte.

$$A(t) = - 1 / R(t) * dR(t) / dt$$

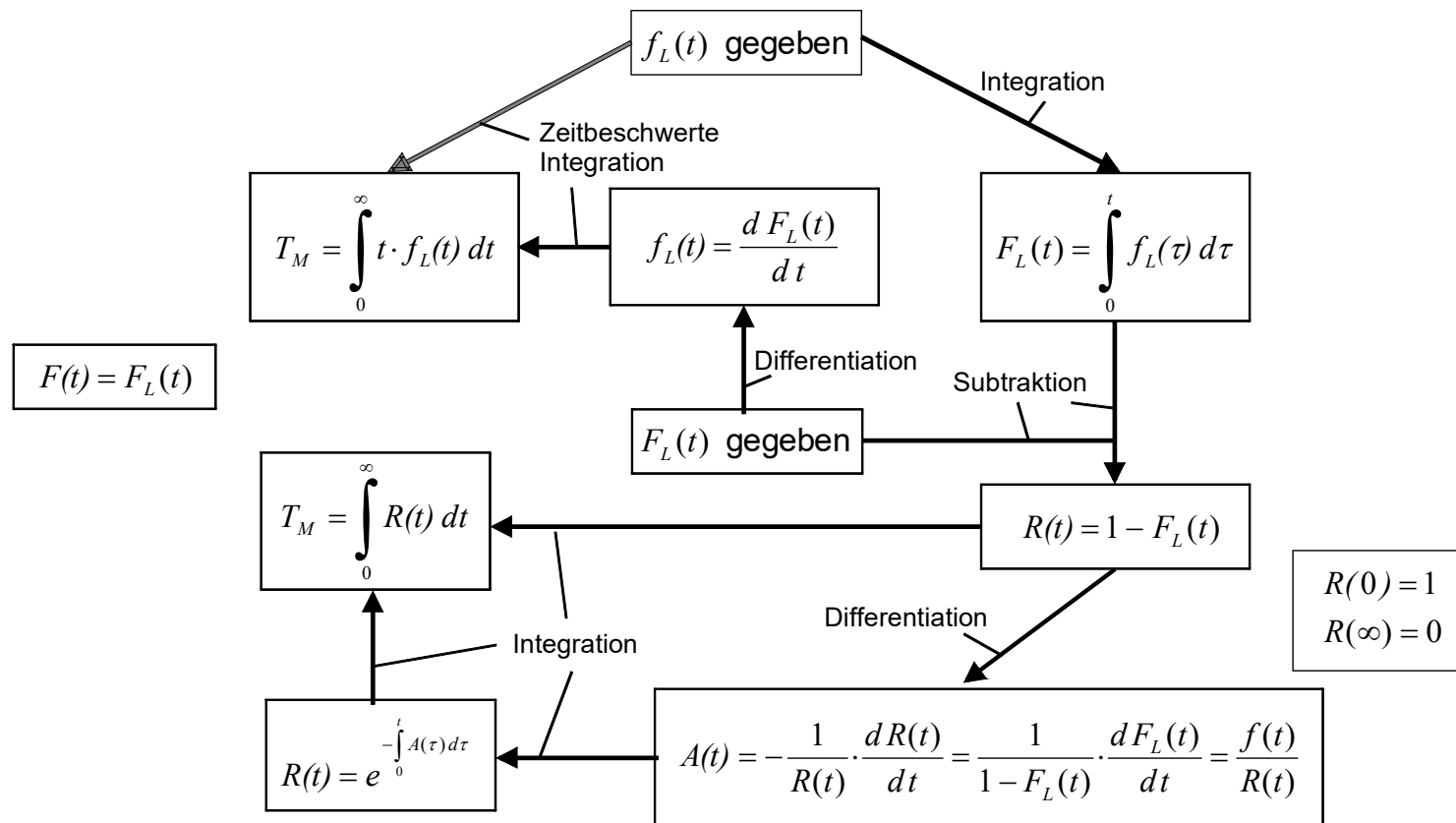
wobei

$R(t)$ = Überlebenswahrscheinlichkeit

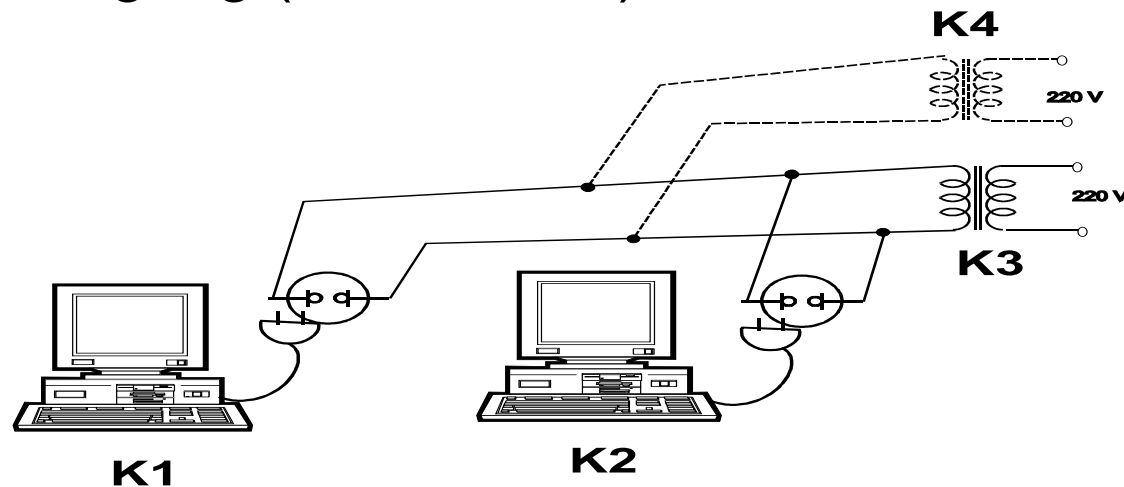
d / dt = Ableitung nach der Zeit t

$A(t)$ = Ausfallrate in [Ausfälle / Zeiteinheit]

Kenngrößen eines nicht-reparierbaren Systems:



Doppelrechnersystem (K1 und K2)
an kritischer Stromversorgung (K3 bzw. K4)



- Welche Systemverfügbarkeit V_s ergibt sich für die vorliegende Anordnung?
- Ist die Systemverfügbarkeit höher als die Verfügbarkeit der Einzelrechner?
- Schafft Redundanz tatsächlich immer eine höhere Systemverfügbarkeit?

Grundlagen der Aussagenlogik:

Es seien **a**, **b** logische Aussagen. Dann folgen wir nachstehender

Notation:

Negation: \bar{a} , \bar{b} , Komplementbildung

Konjunktion: $a \wedge b = a \text{ and } b = a \& b$ UND-Verknüpfung

Disjunktion: $a \vee b = a \text{ or } b = a | b$ ODER-Verknüpfung

Boolesche Algebra:

Wir definieren auf der Menge $M = \{a, b, \dots\}$ der logischen Aussagen $a, b, \dots \in \{0, 1\}$ zwei binäre Operatoren \wedge und \vee sowie eine unäre Operation $\bar{}$ (Komplementbildung) und schreiben hierfür $[M, \wedge, \vee, \bar{}]$. Die Algebra $[M, \wedge, \vee, \bar{}]$ heißt **Boolesche Algebra**.

Boolesche Funktion:

Auf $\mathbf{B} = \{0, 1\}$ definieren wir Funktionen \mathbf{f} mit endlich vielen Argumenten (Variablen) $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ aus \mathbf{B} mit den Funktionswerten $\mathbf{y}_m = \mathbf{f}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ in \mathbf{B} . \mathbf{f} heißt **Boolesche Funktion**.

Unter der Funktion $\mathbf{f}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ versteht man somit die Abbildung

$$\mathbf{f} : \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}^1 = \{0, 1\},$$

wobei

\mathbf{B}^n der **n-dimensionale Binärraum** aller n -Tupel aus Nullen und Einsen ist.

Bei n Variablen gibt es $m = 2^n$ (sprich: 2 hoch 2 hoch n) nicht äquivalente Boolesche Funktionen (im Falle $n = 2$ also 16).

Satz:

Jede Boolesche Funktion lässt sich unter ausschließlicher Verwendung der Operatoren \wedge und \vee sowie der Komplementbildung $\bar{}$ erzeugen. Man sagt auch:

\wedge , \vee und $\bar{}$ bilden ein vollständiges System (Verknüpfungsbasis).

Wir ersetzen im folgenden die **Booleschen** Operatoren \wedge , \vee und $\bar{}$ durch äquivalente arithmetische $+$, $-$ (Addition und Subtraktion) und \cdot (Multiplikation). Es seien $a, b \in \{0, 1\}$. Dann gilt offensichtlich:

Verknüpfung	Boolesche Operation	Arithmetischer Ausdruck
Negation	\bar{a}	$1 - a$
Konjunktion	$a \wedge b$	$a \cdot b$
Disjunktion	$a \vee b$	$a + b - a \cdot b$

Gesetzmäßigkeiten und Verknüpfungsregeln:

Distributivgesetz

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

Absorption / Redundanz

$$a \wedge (a \vee b) = a \quad \text{sowie} \quad a \vee (a \wedge b) = a$$

Idempotenzgesetze

$$1 \vee a = 1 \quad 0 \vee a = a \quad 0 \wedge a = 0 \quad 1 \wedge a = a$$

Vereinfachungen

$$a \cdot a = a^2 = a \quad a \cdot a \dots \cdot a = a^n = a$$

$$a \cdot \bar{a} = 0$$

Anwenden auf Fehlerbaummethode:

Berechnung der System-Verfügbarkeit V_S oder der System-Unverfügbarkeit U_S aus der Redundanzstruktur-Funktion $X_S = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ – abgeleitet aus dem Fehlerbaum.

Vorgehensweise

1. Entwickle einen Fehlerbaum mit den Indikatorvariablen X_1, X_2, \dots, X_n .
2. Ermittle die Redundanzstruktur-Funktion $X_S = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ aus dem Fehlerbaum (logische Funktion):
gfs. Vereinfachung unter Beachtung der Verknüpfungsregeln,
z. B.

$$X_i \wedge \bar{X}_i = 0$$

$$X_i \wedge X_i = X_i$$

Fortsetzung:

3. Ersetze Boolesche Operationen durch äquivalente arithmetische Ausdrücke gemäß obiger Tabelle:

gfs. Vereinfachung unter Beachtung von z. B.

$$X_i \cdot X_i = X_i$$

4. Wenn alle Potenzen $X_i^n = X_i$ für die Variablen X_i verschwunden, ersetze X_i durch U_i und $1 - X_j$ durch $V_j = 1 - U_j$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$).

Beispiel

Siehe Fehlerbaum Absch. 3.3, S. 7.

geg.: $X_S = f(X_1, X_2, \dots, X_n) = ((X_1 \wedge X_2) \vee X_3) \wedge X_4$

ges.: $V_S = ?$

Lösung

$$1. (X_1 \wedge X_2) = X_1 \cdot X_2$$

$$2. (X_1 \wedge X_2) \vee X_3 = X_1 \cdot X_2 + X_3 - X_1 \cdot X_2 \cdot X_3$$

$$3. ((X_1 \wedge X_2) \vee X_3) \wedge X_4 = (X_1 \cdot X_2 + X_3 - X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) \cdot X_4$$

$$\rightarrow X_S = X_1 \cdot X_2 (1 - X_3) \cdot X_4 + X_3 \cdot X_4$$

Nun ersetzen wir:

$$X_i \rightarrow 1 - V_i \quad \text{und} \quad 1 - X_j \rightarrow V_j$$

$$\rightarrow 1 - V_S = (1 - V_1) \cdot (1 - V_2) \cdot V_3 \cdot (1 - V_4) + (1 - V_3) \cdot (1 - V_4)$$

und somit

$$V_S = (V_1 + V_2 - V_1 \cdot V_2) \cdot V_3 \cdot (1 - V_4) + V_4$$

Entwicklungssatz von Shannon:

Jede Boolesche Funktion $f : \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}^1 = \{0, 1\}$ kann für jede ihrer Variablen X_i durch

$$\begin{aligned} f(X_1, \dots, X_i, \dots, X_n) &= X_i \cdot f(X_1, \dots, X_{i-1}, \mathbf{1}, X_{i+1}, \dots, X_n) \\ &\vee \bar{X}_i \cdot f(X_1, \dots, X_{i-1}, \mathbf{0}, X_{i+1}, \dots, X_n) \end{aligned}$$

dargestellt werden. Hierin ist $X_i \cdot f$ die Abkürzung für $X_i \wedge f$.

Kurzform:

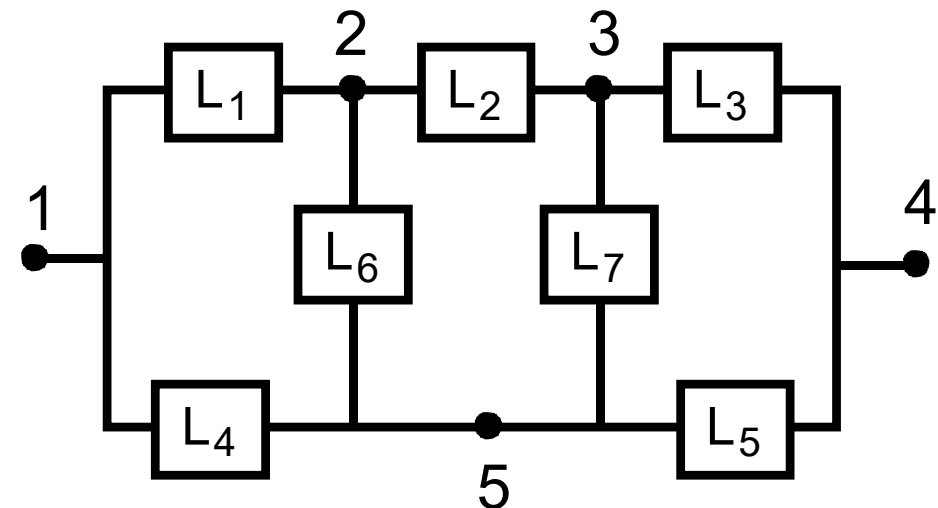
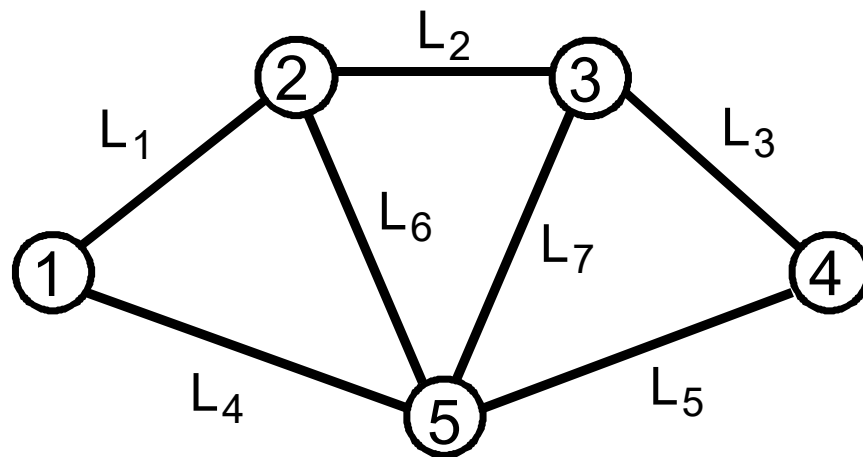
(\wedge = UND-Verknüpfung!)

$$f = X_i \cdot f|_{X_i=1} \vee \bar{X}_i \cdot f|_{X_i=0}$$

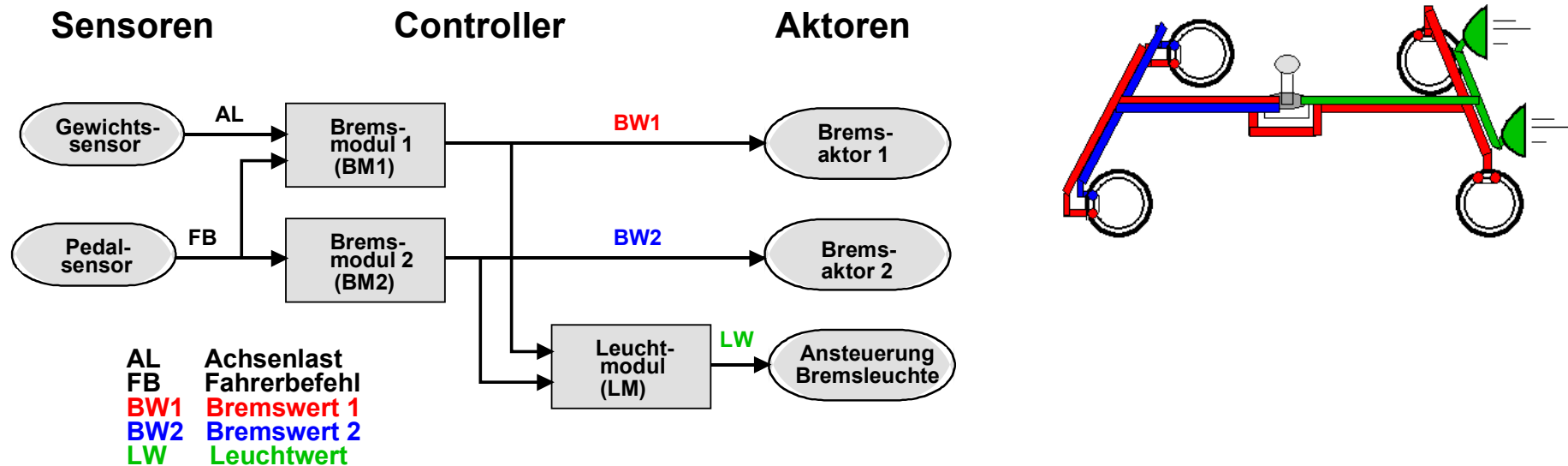
Bei **rekursiver** Anwendung des **Shannonschen Entwicklungssatzes** erhält man eine binär-baumartige Klammerstruktur, aus der man leicht die sogenannte **disjunktive Normalform** (DNF) bilden kann.

Anwendung des Entwicklungssatzes:

Überführung einer komplexen Netzwerkstruktur in einfachere Serien- bzw. Parallelredundanzstrukturen.

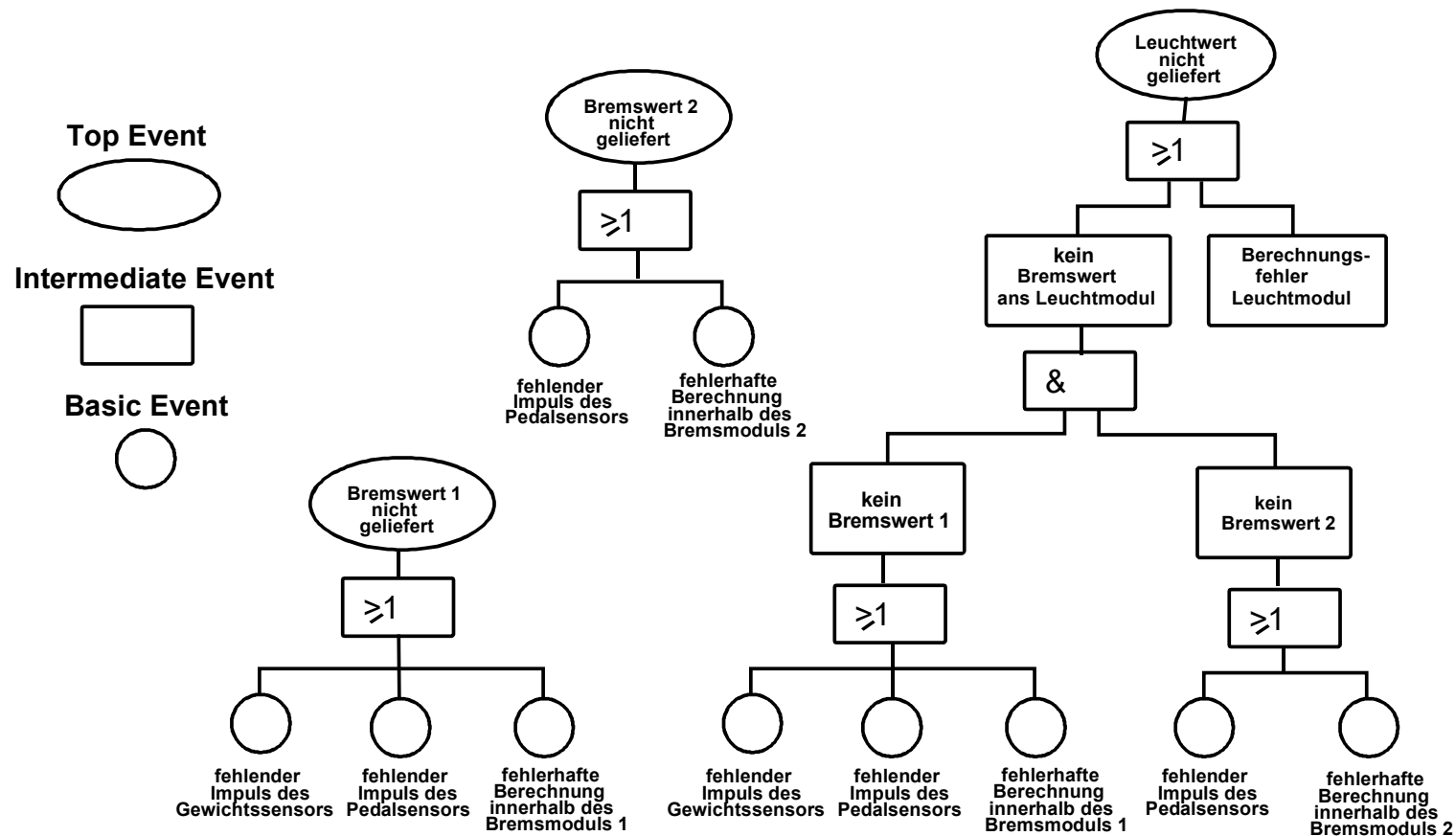


Steuerungssystem einer Zweikreisbremsanlage:

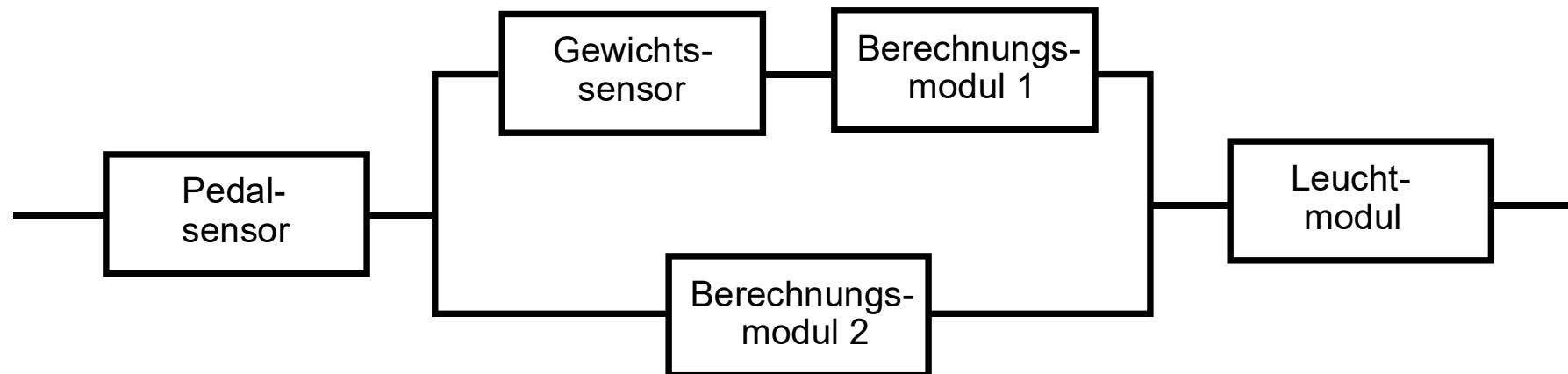


- Fahrer tritt das Bremspedal, aber das Fahrzeug wird nicht oder zu spät gebremst.
- Fahrzeug wird korrekt gebremst, aber die Bremsleuchten leuchten nicht auf.
- Fahrzeug wird gebremst, obwohl das Bremspedal nicht getreten wurde.

Fehlerbäume:



Zuverlässigkeitsblockdiagramm für fehlenden Leuchtwert:



Unverfügbarkeit \Rightarrow **max. $\approx 1.8 \cdot 10^{-4}$**